

کارلو خروجی از این کدها متناظر با توان تفکیک  $\Delta E = 0$  می‌باشدند. تخریب اثر انباشت هنگامی که آهنگ رخدادها در آشکارساز بالا باشد، بسیار با اهمیت است و با زمان مرده سیستم رابطه مستقیم نیز دارد [۵-۱۰]. همچنین در مطالعات مربوط به شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم‌های آشکارسازی، به خاطر تخریب اثر انباشت روی طیف‌های ارتفاع تپ تجربی، بهینه شرایط محاسباتی برای یک سیستم با بهینه شرایط تجربی آن ممکن است منطبق نباشد [۸-۹].

یک رخداد را متناظر با برهمنکش یک تابش در آشکارساز که منجر به ثبت یک تپ در غیاب زمان مرده یا انباشت می‌شود، تعریف می‌کنیم؛ و یک شمارش عبارت است از تپی که در واقع

هنگامی که آهنگ شمارش در آشکارسازی بالا باشد، تپها ممکن است به لحاظ زمانی با یکدیگر تداخل نمایند. به این اثر، عموماً اثر انباشت می‌گویند که با کوچک نمودن پهنای تپها می‌توان آن را کمینه نمود. اثر انباشت، بیشترین آهنگ شمارش آشکارسازها را محدود می‌کند و اثر تخریبی بسیاری روی طیف‌های ارتفاع تپ در میدان‌های با شار بالا دارد [۱].

در محاسبه ارتفاع تپ‌ها در طیف شبیه‌سازی شده توسط روش مونت کارلو، توسط کد‌های محاسباتی نظری  $MCNP$  و  $GEANT$  به دلیل اینکه تاریخچه‌های ذرات به طور تک تک شبیه‌سازی شده و خروجی آنها از متوسط‌گیری تاریخچه‌ها به دست می‌آید [۲-۴]، اثر انباشت لحاظ نشده است. همچنین طیف‌های مونت

$$m = ne^{-n\tau}. \quad (4)$$

برای شمارش بدون انباشت، مثل حالت غیر کاهنده، احتمال آن عبارت است از  $P(0) = e^{-n\tau}$  و انباشت فقط دو رخداد، وقتی اتفاق می‌افتد که اگر یک رخداد در  $t = 0$  روی دهد، رخداد دوم در بازه زمانی  $\tau < t < 0$  روی دهد. در این صورت احتمال انباشت عبارت خواهد بود از:

= احتمال عدم رخداد در  $[t, \infty)$  (احتمال رخداد در  $(dt)$ )

$$\text{احتمال عدم رخداد در } [0, t] = \int_0^t e^{-n\tau} n dt e^{-n\tau} \quad (5)$$

و به همین ترتیب در حالت کلی برای انباشت  $x+1$  رخداد، احتمال عبارت است از [۱]:

$$P(x) = e^{-n\tau} (1 - e^{-n\tau})^x \quad (6)$$

به منظور به دست آوردن میزان تخریب طیف توسط اثر انباشت، یک کد مونت کارلوی انباشت با نرم افزار فورترن نوشته ایم [۱۰]. محاسبات مربوط به شبیه‌سازی اثر انباشت شامل دو قسمت مجزا است. شکل ۱ الگوریتم این محاسبات را نشان می‌دهد.

قسمت اول: در این بخش از کد محاسباتی MCNP برای محاسبه طیف ارتفاع تپ مونت کارلوی سیستم مورد نظر، استفاده می‌شود. خروجی چوب خط F8:p برای طیف ارتفاع تپ مناسب است و بهنجار به یک ذره چشم می‌باشد. همچنین بازده آشکارسازی را می‌توان با محاسبات MCNP برآورد کرد. بنابراین با توجه به بازده آشکارسازی و فعالیت چشم، آهنگ رخدادها در آشکارساز (n) محاسبه می‌شود.

قسمت دوم: در این بخش مطابق با الگوریتم شکل ۱ طیف خروجی ارتفاع تپ از MCNP به عنوان ورودی کد انباشت، ابتدا با یکتابع گاوی مناسب پیچانده می‌شود. پیچیدش گاوی مناظر با توان تفکیک انرژی سیستم می‌باشد و طیف محاسباتی با  $\Delta E = 0$  را به طیفی با گسترده‌گی گاوی  $\Delta E \neq 0$

و با احتساب زمان مرده یا انباشت توسط سیستم ثبت می‌شود. به علت زمان مرده یا انباشت، تعداد شمارش‌ها از تعداد واقعی رخدادها کمتر است؛ زیرا شمارش‌ها شامل شمارش تپهای انباشتی نیز می‌باشد که متشکل از چندین رخداد هستند. کمترین زمان لازم برای تفکیک دو رخداد متوالی که به طور مجزا ثبت می‌شوند را پنهانی زمانی تپ (τ) یا توان تفکیک زمانی سیستم می‌گویند. آهنگ رخدادها را با  $n$  و آهنگ شمارش را با  $m$  نمایش می‌دهیم. رابطه  $n$  با  $\tau$  به کاهنده<sup>۱</sup> یا غیر کاهنده<sup>۲</sup> بودن سیستم بستگی دارد [۱].

در سیستم‌های غیر کاهنده، رابطه بین آهنگ شمارش و آهنگ رخدادها به صورت زیر است:

$$m = \frac{n}{1+n\tau} \quad \text{یا} \quad n = \frac{m}{1-m\tau}, \quad (1)$$

حال احتمال مربوط به شمارش‌های متناظر با انباشت دو، سه، ... رخداد را می‌توان از توزیع پواسون به دست آورد. در طی زمان  $\tau$  تعداد متوسط رخدادها  $n\tau$  است مطابق با توزیع پواسون، احتمال اینکه  $x$  رخداد در این بازه زمانی رخ دهن، عبارت است از:

$$P(x) = \frac{(\bar{x})^x e^{-\bar{x}}}{x!} = \frac{(n\tau)^x e^{-n\tau}}{x!} \quad (2)$$

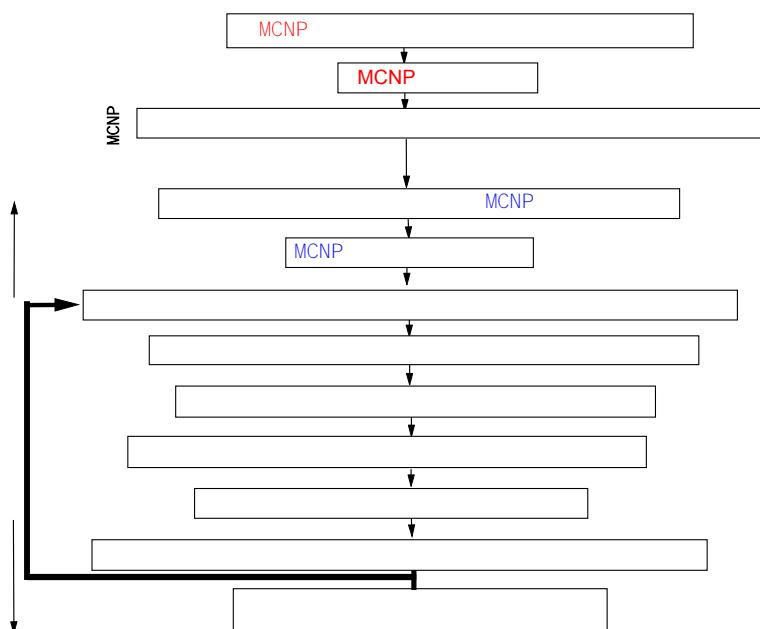
اگر هیچ رخداد دیگری در طی زمان  $\tau$  مربوط به یک رخداد روی ندهد، شمارش بدون انباشت خواهد بود و در این صورت  $x=0$  و احتمال آن  $P(0) = e^{-n\tau}$  است. برای شمارش‌های متناظر با انباشت دو رخداد،  $x=1$  و احتمال آن  $P(1) = n\tau e^{-n\tau}$  می‌باشد، و در حالت کلی برای انباشت  $x+1$  رخداد، احتمال عبارت است از [۱]:

$$P(x) = \frac{(n\tau)^x e^{-n\tau}}{x!}. \quad (3)$$

در سیستم‌های کاهنده، رابطه بین آهنگ شمارش و آهنگ رخدادها به صورت زیر است

۱. Paralyzable

۲. Nonparalazable



شكل ۱. الگوریتم برنامه انباشت که بر اساس روش مونت کارلو نوشته شده است.

تپهایی که سازنده تپ انباشتی هستند تعیین می‌شود. تعیین زمان شروع هریک از تپها به کمک اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت و در بازه  $[0, \tau]$  انجام می‌گیرد. سپس با برهم نهی خطی این تپها، تپ انباشتی تولید می‌شود. بیشینه مطلق تپ انباشتی به عنوان دامنه آن در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب با تعیین بازه انرژی متناظر با دامنه تپ انباشتی، در آن بازه یک شمارش منظور می‌کنیم. با تکرار نمونه‌گیری‌ها طیف ارتفاع تپ مونت کارلو با اثر انباشت به دست می‌آید.

با کاربیست کد مونت کارلوی انباشت در مورد طیف سنجی چشمهدای گاما نظیر چشمء  $^{137}\text{Cs}$ ، می‌توان اهمیت آن را در تصحیح طیف‌های مونت کالو نشان داد. برای این منظور محاسبات را برای هندسه شکل ۲-الف انجام داده‌ایم. این هندسه آزمایشی است که با ۵ چشمء سزیم آزماشگاهی در داخل اطاقک سربی با آشکارساز  $3\text{in} \times 3\text{in}$  ۳ دور سدیم انجام شده که در آن آهنگ شمارش  $1.773 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$  بوده است.

شکل ۲-ب طرحوار پیچش گاؤسوی یک قله تک انرژی را نشان

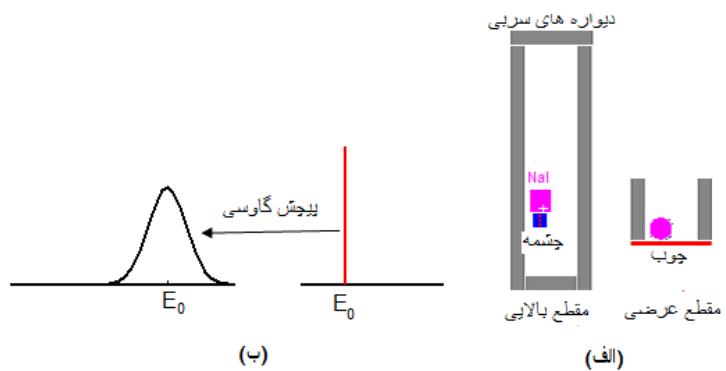
تبديل می‌کند. پیچش گاوی بدان سبب اعمال می‌گردد که ارتفاع تپ‌های با انرژی ذخیره شده یکسان در آشکارساز، مثل قلهٔ فتوالکتریک، دارای توزیع پواسون است که در شمارش‌های بالا، با توزیع گاوی همسان است.

کد انباشت برای شبیه‌سازی مدل‌های انباشت غیر کاهنده و کاهنده نوشته شده است. در محاسبات انباشت، برای شکل تپ،تابع تحلیلی زیر را در نظر گرفته‌ایم:

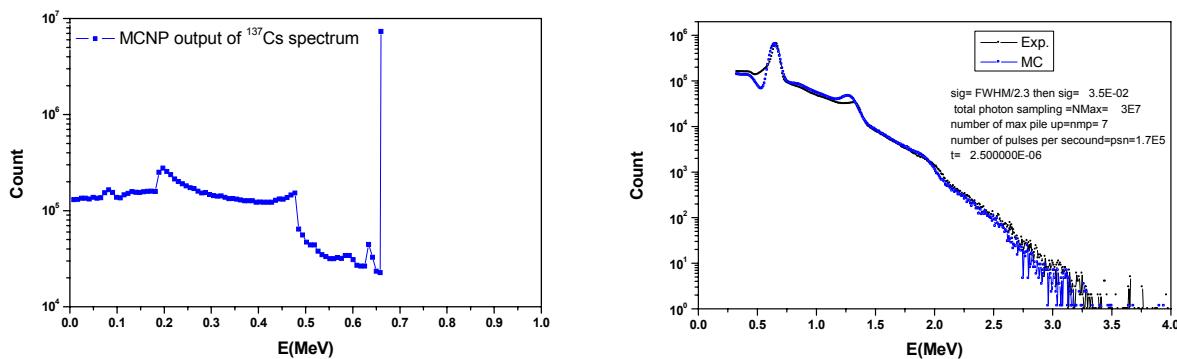
$$F(t) = \begin{cases} \varphi a_{\circ} (1 - e^{-(\gamma(t - t_{\circ})/\tau)}) e^{-(\gamma(t - t_{\circ})/\tau)} & t \geq t_{\circ} \\ \dots & t \leq t_{\circ} \end{cases} \quad (\text{V})$$

این تابع، تپی را با زمان شروع  $t$  و دامنه  $a$  نشان می‌دهد.

با انتخاب مقدار  $\tau$  و مطابق با آهنگ رخدادها در آشکارساز و معالات (۳) و (۶) احتمال‌های مربوط به انباشت‌های چند گانه، محاسبه می‌شود. سپس با یک عدد تصادفی  $(r)$  با توزیع یکنواخت و در بازه  $[0, 1]$  درجه انباشت مشخص می‌گردد. به این ترتیب که اگر  $r$  از  $P$  کوچکتر باشد رخداد بدون انباشت خواهد بود و از طیف مونت کارلو با پیچش گاوی این تپ نمونه‌گیری می‌شود. در غیر این صورت درجه انباشت یک تپ نمونه‌گیری می‌شود. با این صورت درجه انباشت  $(n_p)$  برابر با  $k$  است، اگر  $\sum_{i=0}^{k-2} P(i) < r \leq \sum_{i=0}^{k-1} P(i)$  باشد. با نمونه‌گیری  $n_p$  تپ از طیف مونت کارلو با پیچش گاوی، دامنه



شکل ۲. (الف) هندسه آزمایش با چشمۀ سزیم، (ب) پیچش گاوسی قله تک انرژی در  $E_0$ .

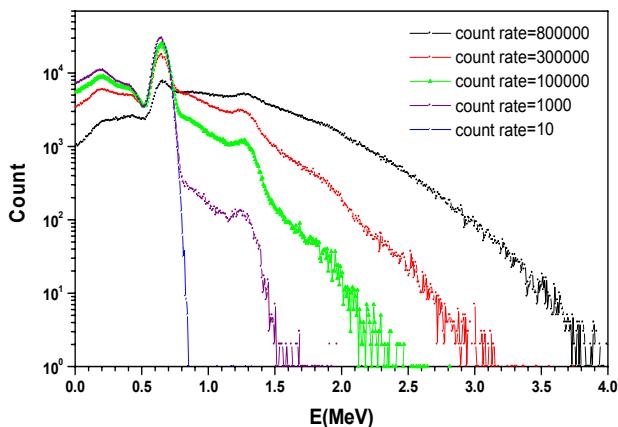


شکل ۳. الف) طیف خروجی کد MCNP برای چشمۀ سزیم بدون اثر انباشت و پیچش گاوسی؛ ب) طیف تجربی و طیف مونت کارلوی با اثر انباشت برای چشمۀ  $^{137}\text{Cs}$  و آشکارساز  $(\text{NaI}(\text{TI}) 2in \times 2in)$ .

دو گانه در  $1/324$  MeV و سه گانه در  $1/986$  MeV به خوبی مشاهده می‌شوند؛ که با افزایش درجه انباشت، پهنای قله‌های انباشتی نیز بیشتر شده است. با توجه به انرژی‌های انتهایی طیف، انباشت تا مرتبه ۶ یعنی  $3/972$  MeV نیز رخ داده است. در شکل ۴ سهم گاماهای بدون انباشت، و زیر طیف‌های انباشتی دو تا شش گانه نشان داده است. لازم به ذکر است که این زیر طیف‌ها فقط با شبیه‌سازی قابل محاسبه‌اند. این نمودار نشان می‌دهد که سهم عمده زمینه در ناحیه قله فتوالکترونیک ناشی از انباشت دوگانه تپ‌ها است. همچنین دیده می‌شود که با افزایش مرتبۀ انباشت، احتمال وقوع رخداد انباشتی کمتر می‌گردد. حدود  $74/77$ % شمارش‌ها در قله فتوالکترونیک  $662\text{ MeV}^0$ ، ناشی از رخدادهای بدون انباشت،  $22/27$ % شمارش‌ها متعلق به انباشت دوگانه، و  $1/88$ % مربوط به انباشت سه گانه تپ‌هاست. و سهم ناچیزی هم به بقیه مراتب بالاتر انباشت مربوط می‌شود.

می‌دهد.تابع مناسب گاوسی برای هموارسازی متناظر با توان تفکیک انرژی سیستم آشکارسازی انتخاب می‌شود و برای تطابق طیف‌های محاسباتی با طیف‌های تجربی به کار می‌رود. در شکل ۳-الف طیف خروجی کد MCNP برای چشمۀ سزیم بدون اثر انباشت و پیچش گاوسی ارائه شده است و در شکل ۳-ب مقایسه بین طیف تجربی و طیف مونت کارلوی با اثر انباشت در مُد غیرکاهنده برای چشمۀ  $^{137}\text{Cs}$  و آشکارساز یدور سدیم استوانه‌ای با طول ۳ اینچ و قطر ۳ اینچ نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهند که تطابق بسیار خوب بین طیف‌های محاسباتی و تجربی وجود دارد. فقط تفاوت‌هایی در انرژی کمتر از قله سزیوم و قله انباشت دوگانه دیده می‌شود، که این امر ممکن است ناشی از عواملی نظیر در نظر نگرفتن پدیده انباشت دُم تپ‌ها و یا انتخاب نوع تابع تحلیلی برای تپ نهایی باشد.

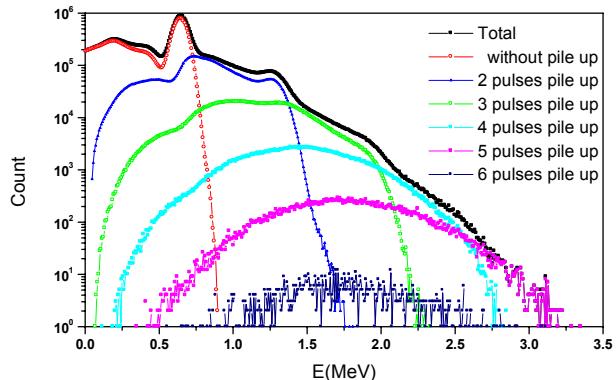
همچنین علاوه بر قله اصلی  $662\text{ MeV}^0$ ، قله‌های انباشتی



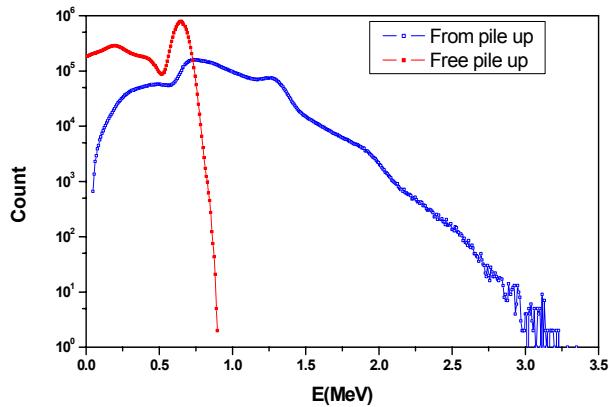
شکل ۶. نمودار طیف‌های محاسباتی برای آهنگ رخدادهای متفاوت ولی تعداد رخدادهای یکسان.

تخربی انباشت روی طیف بیشتر می‌گردد و از ارتفاع و سطح زیر قله فتوالکترونیک کاسته شده است.

الگوریتم ارائه شده در این تحقیق، روش ساده و کارایی را برای شبیه‌سازی اثر انباشت تپ‌ها را در انواع سیستم‌های آشکارسازی بیان می‌کند. با کاربست کد انباشت نوشته شده برای سیستم آشکارسازی گاما برای چشم  $^{137}\text{Cs}$  و آشکارساز یدور سدیم استوانه‌ای، طیف محاسباتی در تطابق بسیار خوبی با طیف تجربی به دست آمد. در طیف، علاوه بر قله اصلی  $0.662\text{ MeV}$ ، قله‌های انباشتی دو گانه در  $1.324\text{ MeV}$  و سه گانه در  $1.986\text{ MeV}$  به خوبی مشاهده می‌شوند؛ که با افزایش درجه انباشت، پهنای قله‌های انباشتی نیز بیشتر شده است. با توجه به انرژی‌های انتهایی طیف، انباشت تا مراتب ۶ یعنی  $3/972\text{ MeV}$  نیز رخ داده است. طیف‌های محاسباتی برای آهنگ رخدادهای متفاوت نشان می‌دهد با افزایش آهنگ رخدادها اثر تخریبی انباشت روی طیف بیشتر می‌گردد و از ارتفاع و سطح زیر قله فتوالکترونیک کاسته شده است. این الگوریتم قابل کاربرد برای چشم‌ها و آشکارسازهای مختلف است و می‌تواند در تصحیح اثر انباشت برای سیستم‌های آشکارسازی مختلف مفید و مؤثر باشد.



شکل ۴. طیف کل و زیر طیف‌های بدون انباشت، و انباشتی دو گانه تا شش گانه.



شکل ۵. طیف‌های صرفأً ناشی از انباشت و بدون انباشت.

طیف‌های بدون انباشت و ناشی از کلیه انباشت‌ها در شکل ۵ ارائه شده است؛ داده‌ها نشان می‌دهد که برای این وضعیت حدود  $59/30\%$  شمارش‌ها در اثر انباشت از دست رفته‌اند، و نسبت شمارش‌های بدون انباشت به شمارش‌های انباشتی  $1/933$  است. به عبارتی نزدیک به یک سوم شمارش‌ها ناشی از انباشت دو یا چند تپ است، که تخریب قابل ملاحظه‌ای در طیف ایجاد می‌کند.

شکل ۶ نمودار طیف‌های محاسباتی را برای آهنگ رخدادهای متفاوت نشان می‌دهد که در تمام آنها تعداد فوتون‌های نمونه‌گیری شده یکسان بوده است. همان‌طور که دیده می‌شود و انتظار داشته‌ایم، با افزایش آهنگ رخدادها اثر

2. J F Briesmeister, MCNP Monte Carlo N-Particle Transport Code, Los Alamos National Laboratory (2000).

1. G F Knoll, "Radiation Detection and Measurement," Third Edition, Wiley Inc., New York (2000).

- and Methods section A, **498** (2003) 453.
8. A A Mowlavi, R Koohi-Fayegh, *Nuclear Instruments and Methods section A*, **552** (3) (2005) 559.
9. M Palomba, G D'Erasto, A Pantaleo, *Nuclear Instruments and Methods section A*, **498** (2003) 397.
10. A A Mowlavi, M de Denaro, M R Fornasier, A Binesh, *Applied Radiation and Isotopes*, **64** (3) (2006) 390.
3. S Agostinelli, J Allison, J Amako, J Apostolakis, et al., *Nuclear Instruments and Methods section A*, **506** (2003) 250.
4. I Kawrakow, D W O Rogers, National Research Council of Canada Report PIRS-701 (2001).
5. T Fazzini, G Poggi, P Sona, N Taccetti. *Nuclear Instruments and Methods section A*, **356** (1995) 319.
6. F H Tenney, *Nuclear Instruments and Methods section A*, **219** (1984) 165.
7. U van Mollendorff, H Giese, *Nuclear Instruments*